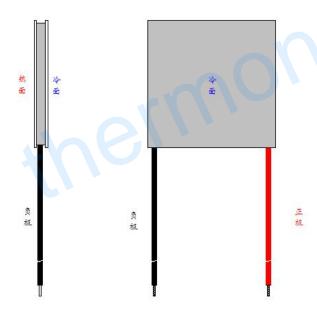
## 半导体致冷片冷热面的检验方法

1. 半导体致冷片的焊线方式



如上图所示,当引线朝使用者方向放置且红线靠右时,器件的上表面为冷面。

- 2. 半导体致冷片的冷热面检验方法
- 2.1 准备一台直流稳压电源,将电压调到 2-3V 档;
- 2.2 关闭直流电源,将半导体致冷片的红线连接电源的正极,黑线连接电源的负极;
- 2.3 按上图方式放置器件并将引线朝向检验人员,用两个手指分别触磁器件的两面,打开直流电源,约 1-3 秒后可明显感受到器件上表面变冷,下表面发烫,即可判断器件符合要求;
- 2.4 如发现器件上表面变热,则可判断器件引线接反了;如发现器件上表面没有变冷或热, 且直流电源的电流为 0A,则可判断器件不通不合格;
- 2.5 可利用红外探温仪替代手指判断器件的冷热面:
- 2.6 注意事项:判断完器件冷热面是否正常后需及时断开电源,防止器件在没有散热措施的情况下长时间高温工作而损坏器件。